Search Notes			

Application No.	Applicant(s)	
10/052,173	PHAN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
DuyVu n Deo	1765	

	SEAR	CHED			
Class	Subclass	Date	Examiner		
search	updated	2/10/2004	DV		
			•		
			<u></u>		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·			<u></u> *		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
·	~		<u> </u>		
	. <u></u>				
- <u>·</u> •			· <u>·</u>		
		····	·		
	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

10. 15. 10.

公司 100

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
438	706	2/10/2004	DV
	709-711	2/10/2004	DV
	714, 717	2/10/2004	DV
!	23-725 01,765	2/10/2004	DV

	•	STRATEGY)	
	DATE	EXMF	
<u> </u>			
·			
<del></del>			
<u> </u>			
	*		